PASJ2018 WEP015

J-PARC 主リング主電磁石用電源のコンデンサバンクのためのヒューズ溶断試験 FUSE ARCING TEST FOR CAPACITOR BANK OF MAIN MAGNET POWER SUPPLY IN J-PARC MR

森田裕一^{#, A)}, 栗本佳典 ^{A)}, 佐川隆 ^{B)}, 下川哲司 ^{A)}, 内藤大地 ^{A)}, 三浦一喜 ^{A)}, 吉野達也 ^{C)}

Yuichi Morita^{#, A)}, Yoshinori Kurimoto^{A)}, Ryu Sagawa^{B)}, Tetsushi Shimogawa^{A)}, Daichi Naito^{A)}, Kazuki Miura^{A)},

Tatsuya Yoshino^{C)}

^{A)} High Energy Accelerator Research Organization ^{B)} Universal Engineering

^{C)} Nichicon (Kusatsu) Corporation

Abstract

The upgrade of the main ring (MR) of the Japan Proton Accelerator Research Complex (J-PARC) involves the increase in the power variation of the electrical system. Since the main magnets are the primary source of the power variation, a capacitor bank (CB) is developed and installed in the power supply of the main magnets. The CB stores the excitation energy of the magnets so that the power variation is suppressed. The CB was designed with a sufficient consideration to avoid serious failures. The number of fuses were installed in the CB to avoid energy concentration on a short-circuited capacitor. The scheme for the safe dissipation of the concentrated energy was also employed. A fuse arcing test was carried out to clearly demonstrate the fuse reliability. The result shows the pre-arcing time of the fuse satisfies the designed value.

1. はじめに

J-PARC (Japan Proton Accelerator Research Complex) の主リング(MR)は T2K (Tokai to Kamioka) と呼ばれる 長基線ニュートリノ実験に陽子ビームを供給しており、更 なるビーム増強が求められている。繰返し周期を現状の 2.48 秒から1.3 秒に速めて、ターゲットに供給するビーム 電流を増加することによるビーム増強を計画している。 MR の仕様を Table 1 に示す。

1 サイクルの間にビームは3 GeV から30 GeV に加速 され、主電磁石の励磁電流はビームの運動量増加に合 わせて上昇する。2.48 秒繰返し時における主電磁石の 励磁電流および出力電圧の測定パターンを Fig. 1 に示 す。これらは偏向電磁石ファミリ1 台のパターンである。 偏向、四極、六極電磁石に対してそれぞれ6台、11台、 3 台のファミリがある。電源の出力電圧 V は、

$$V = RI + L\frac{dI}{dt} \tag{1}$$

と表される。ここで、RとLはそれぞれ負荷の抵抗値とイ

Beam Energy [GeV]	3 (injection)	
	30 (extraction)	
Beam Power [kW]	450 (present)	
	> 750 (upgrade)	
Repetition Cycle [s]	2.48 (present)	
	1.3 (upgrade)	

Table 1: Specifications for MR

yuichi.morita@kek.jp

ンダクタンス値、I は励磁電流である。すなわち、高繰返 し化によって dI/dt が増加すると電源の出力電力 VI が増 加する。負荷の励磁エネルギーは運転サイクル毎に系 統へ戻されているので、系統の電力変動が増加すること になる。主電磁石はその大きな励磁エネルギーのため、 MR の電力変動の主要な原因となっている。Figure 2 の 点線は MR のすべての主電磁石によって引き起こされる 系統の電力変動を表し、ピーク間で 60 MVA となってい る。この値は増強後には 100 MVA を超えると予想され、 電力会社が許容しない。

電力変動を抑制するための有力な方法にコンデンサ によるエネルギー貯蔵がある。並列に多数接続されたコ ンデンサからなるコンデンサバンク (CB) を主電磁石電 源に導入する。ビーム取出し後に励磁エネルギーが電



Figure 1: Measured patterns of excitation current and output voltage of PS for a single bending magnet family in the MR.

PASJ2018 WEP015

磁石から CB に移動する。そして次の運転サイクルでこのエネルギーが CBから電磁石に移動し、励磁に再利用される。よって、CB と負荷の間で大部分のエネルギーがやり取りされ、電源と系統の間のエネルギーの移動を抑制できる。Figure 2 の実線で示されているように CB がある場合、系統の電力変動は増強後であっても 60 MVA 以下に抑えられる。



Figure 2: Calculated power variations in the MR. No tracking error of the excitation current is assumed.

CBを設計する上で気を付けなければならない点は以下の通りである。

- コンデンサの種類: 電解液やオイルを含んでいるとコンデンサ内部で 短絡事故が起こった場合、液が蒸発し、コンデンサ が設置されている場所の気圧が急激に上昇する。 もしコンデンサが閉じた空間に設置されているなら、 空間のどこかに圧抜きの弁が必要となる。液が可燃 性であるなら、防火についても注意が必要である。 よって、気圧上昇と防火を解決できるセルフヒーリン グ (SH) タイプの乾式フィルムコンデンサを選定し た。
- 事故の波及: 並列に接続された回路は事故が起きた時に影響が 波及するので設計に注意が必要である。コンデン サに直列にヒューズを取り付けることで波及を防ぐ。
- 短絡エネルギーの消費:
 米国の国立点火施設(NIF)の CB の例では、短絡 事故が発生すると 2MJ ものエネルギーがコイルに 集中し、消費する設計となっている。短絡試験の結 果、コイルから破片が飛散することがわかっている ので、飛散物を閉じ込めるための壁が用意されて いる[1]。我々の設計では素子の変形や破裂が発 生しないようにエネルギー消費の方法を検討した。

CBの設計の詳細は次章で紹介する。CBの安全性は ヒューズに強く依存しているため、ヒューズの溶断試験を 行って設計の妥当性を確かめた。

本報告では新しい偏向電磁石電源および CB の設計 とヒューズ溶断試験を紹介する。[2]

2. コンデンサバンク

2.1 コンデンサバンクを備えた偏向電磁石用新電源

MR の偏向電磁石のための新電源の回路図と仕様を Fig. 3 と Table 2 にそれぞれ示す[3,4]。電源は 2 台の AC/DC 変換器、6 台のコンデンサバンクモジュール (CBM)、直列に接続された 6 台の DC/DC 変換器からな る。6 台のうち 4 台の CBM は AC/DC 変換器と変圧器に 接続されていない。これらはフローティングコンデンサと 呼ばれる[5]。AC/DC 変換器と変圧器が無いため、価格 と物量を減らすことができる。CBM を初充電後、この充 電エネルギーを使って、電源は電磁石を励磁する。励磁 エネルギーは系統へ戻らずに CBM を充電し、次のサイ クルに再利用される。



Figure 3: Schematic of new PS for bending magnets in the MR.

2.2 コンデンサバンクモジュール

偏向電磁石電源の CB は 6 台の CBM で構成され、1 台の CBM は 24 台のコンデンサユニットからなる。コンデ ンサユニットは充電電圧 1667 V で 0.03 MJ のエネルギー を蓄える。すなわち、1 台の CBM が蓄えるエネルギーは 0.7 MJ である。

2.3 コンデンサユニット

コンデンサユニットの回路図と仕様を Fig. 4 と Table 3 にそれぞれ示す。コンデンサユニットは 1 台のヒューズ (Table 4)、4 台のコンデンサ(Table 5)、16 台の抵抗器 (Table 6 の IRV300LN)で構成される。既に述べたように 最大充電エネルギーは0.03 MJである。重量は約140 kg である。これらの値はメンテナンスに妥当な大きさとして 選ばれた。ヒューズ付きのユニットとしたことにより、短絡 したコンデンサにエネルギーが集中するのを防ぐ。2.5 節

Proceedings of the 15th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan August 7-10, 2018, Nagaoka, Japan

PASJ2018 WEP015

-	
Peak Output Current [A]	1600
Peak Output Voltage [V]	6000
Total Inductance of Load [H]	1.6
Total Energy of CB [MJ]	4.2
Energy / CBM [MJ]	0.7
Number of CBMs	6
Energy / Capacitor [kJ]	7
Maximum Charging Voltage [V]	1667

Table 2: Specifications for the New PS with CBs



Figure 4: Circuit diagram of the capacitor unit.

で述べるように、ヒューズが働いた後に消費されるのは1 台のコンデンサユニットの充電エネルギーのみである。こ の充電エネルギーは素子の変形を伴うことなく抵抗器に よって消費可能である。また、抵抗器はエネルギー消費 の他にコンデンサ間の電流バランスを取る役割も持つ。

Capacitance [mF]	20
Maximum Charging Voltage [V]	1667
Maximum Stored Energy [MJ]	0.03
Weight [kg]	140

Table 4: Specifications for the Fuse

Current in Operation [Arms]	19
Rated Current [A]	40
Rated Voltage [V _{dc}]	2000
Energy Integrals I^2t (A ² s)	390 (Pre-Arcing)

Table 5:	Specifications	for the Ca	pacitor
----------	----------------	------------	---------

Capacitance [mF]	5
Rated Voltage [V]	1667
Rated Current [Arms]	20
Weight [kg]	23.5

Fable 6:	Specifications	for the	Resistors
----------	----------------	---------	-----------

	IRV300LN	IRV600PN
Resistance $[\Omega]$	0.2	0.1
Rated Voltage [Vac]	5500	3500
Rated Power (w/o chassis) [W]	210	300
Energy Tolerance [kJ]	11.1	17.5

2.4 組立

Figure 5 に示したように 3 台のコンデンサユニットが 1 台の金属架台にインストールされる。1 台の CBM には 8 台の金属架台が存在する。2 台の CBM は 1 台の 40 フィートハイキューブ海上コンテナ内に設置される。よって、1 台のコンテナには 1.4 MJ のエネルギーが蓄えられる。1 台の偏向電磁石電源には 3 台のコンテナが存在する。Figure 6 に示したように、コンテナ内の両サイドにそれぞれ 8 台の架台が設置される。CBM の P 側あるいは N 側と架台は等電位としており、コンテナからは架台ごと電気的に絶縁されている。

コンテナは電源棟に隣接するヤードに設置される。コ ンテナにはエアコン、空気を循環するファン、LED 照明 が付いている。



Figure 5: Capacitor unit and metal rack.



Figure 6: Metal racks installed in the marine container.

2.5 短絡事故時のエネルギー消費設計

コンデンサユニットはコンデンサ内部短絡が起こると、 抵抗器によって充電エネルギーを安全に消費するように

PASJ2018 WEP015

設計されている。Figure 7 (a) に示したように、コンデンサ 内部短絡が起こると大電流が短絡コンデンサに集中し、 ヒューズが切れる。その結果、短絡したコンデンサユニッ トは回路から切り離され、電流の集中が止まる。その後は このコンデンサユニット内の充電エネルギーだけが短絡 コンデンサに流れ続ける。この様子を Fig. 7 (b) に示す。 Vunit はコンデンサの充電電圧を表す。

短絡コンデンサに接続されている 4 台の抵抗器で消 費されるエネルギーを見積もった。溶断時間を t_{arc} とし、 ヒューズが切れる前の V_{unit} は常に 1700 V 一定と仮定す る。ヒューズが切れた後の V_{unit} は指数関数的に減少する。 電圧曲線を Fig. 8 に示す。 t_{arc} の間、4 台の抵抗器 (合成 抵抗は 50 mΩ)に印加される電圧は 1700 V なので、溶 断前の消費エネルギー U_I は 5.78×10⁴ t_{arc} kJ と計算され る。溶断後の消費エネルギー U_2 は 16.3 kJ と計算される。 これは短絡コンデンサ以外の 3 台のコンデンサの充電エ ネルギーである。よって、全消費エネルギー U_{total} は

$$U_{total} = U_1 + U_2 \tag{1}$$

と表される。

Table 6 のエネルギー許容量 (IRV300LN) によると、 U_{total} は 44.4 kJ 以下でなければならない。よって、 t_{arc} = 490 μ s が得られる。

3. ヒューズ溶断試験

第2章で見たように、CBの安全はヒューズに強く依存 している。ヒューズの信頼性を確かめるためにヒューズ溶 断試験を行った。この試験ではヒューズ溶断時間および 抵抗器のエネルギー吸収量を測定した。

3.1 試験設備

2 つの場合について短絡事故の回路シミュレーション を行った。一つは CBM 1 台の全コンデンサユニットを用 いたフルスケールモデルで、もう一つはコンデンサユニッ ト2 台の 2 ユニットモデルである。後者はヒューズ溶断試 験の最小構成であり、充電エネルギーは前者の 1/12 で ある。これら 2 つのモデルのヒューズに流れる短絡電流 に違いがみられなければ、安全性を考慮して試験には 後者のモデルを採用したい。

短絡したコンデンサユニットのヒューズに流れる電流実 効値の時間変化をシミュレーションした結果を Fig. 9 に



Figure 7: Current paths in the short-circuit fault before (a) and after (b) the fuse arcing.



Figure 8: Voltage curve of capacitor in the short circuit fault.

示す。電流実効値と溶断曲線(*Pt* = 390)の交点がヒュー ズ溶断時間を表す。交点付近では2つの電流実効値曲 線の時間差は490 μsよりも十分小さい。そのため、溶断 時間の測定に対しては2ユニットモデルで試験すれば十 分であると結論付けられる。

シミュレーション結果に従って、2 ユニットモデルのセッ トアップが準備された。回路図を Fig. 10 に示す。短絡を 模擬するためにコンデンサの一つが電磁接触器 MC3 に 代えられている。抵抗器の数を最小化するため、MC3 を 含んだコンデンサユニットだけに抵抗器が取り付けられ ている。ここでは IRV300LN ではなく、IRV600PN を使用 した。もう一方のコンデンサユニットには抵抗器が無い。 コンデンサユニットはダイオード整流器を通して充電され る。定格電圧まで充電された後、電磁接触器 MC1 に よってセットアップが系統から切り離される。その後、 MC3 が閉じる。

Figure 10 にあるように、4 台の電流プローブ CT1-4 と 2 台の高圧差動プローブ V1,V2 が取り付けられている。 試験時に予期せぬ破片が飛んでくるのを防ぐために両 方のコンデンサユニットを1 mm 厚の鉄板で覆った。

3.2 試験結果

試験の結果を Fig. 11 と 12 に示す。MC3 が閉じた時 間を Closing Point としている。縦軸の記号は Fig. 10 に 示されているプローブに対応する。電流ピーク時が溶断 したタイミングを表しており、溶断時間として 45±5 μs が得 られた。よって、溶断時間が 490 μs 未満という要求を満



Figure 9: Simulated RMS currents that flow in the fuses of the failed capacitor units.

Proceedings of the 15th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan August 7-10, 2018, Nagaoka, Japan

PASJ2018 WEP015



Figure 10: Circuit schematic of the fuse arcing test.



Figure 11: Measured currents and voltage of the fuse arcing test.



Figure 12: Measured current and voltage of the fuse arcing test. The time scale is different from that in Figure 11.

たすことを確認できた。フルスケールモデルの溶断時間 も同様に 490 μs よりも早いと期待される。ヒューズが正常 に働いたので V2 の減少はほとんど見られない一方、V1 はゼロに近づいている。

CT1 と 2 のピーク電流から、MC3 に流れる電流は約50 kA ピーク、1 ms 幅の三角波として近似できる。よって、MC3 に接続されている抵抗器4 台で消費されるエネルギーは20.8 kJ と見積もられる。これは抵抗器

(IRV600PN)4台のエネルギー許容量69.8 kJよりも小さい。試験の後、各素子を目視したところ、いかなる変形も認められなかった。

4. まとめ

ビームパワーを増強するために J-PARC MR の高繰返 し化が進んでいる。その主要なコンポーネントとして新し い主電磁石電源を開発中である。ただし、この計画では 系統の電力変動の増加が懸念されている。そのため、コ ンデンサによるエネルギー貯蔵方式を採用する。

CB は十分な安全検討に基づいて開発された。使用 するコンデンサは SH タイプの乾式フィルムコンデンサで ある。4 台のコンデンサ毎(0.03 MJ)に 1 つのヒューズが 取り付けられる。短絡したコンデンサに流れ込むエネル ギーを消費するために全てのコンデンサには直列に抵 抗器が接続されている。

ヒューズの設計溶断時間を確かめるためにコンデンサ ユニット2 台によるヒューズ溶断試験が行われた。45±5 µsという溶断時間が得られ、設計値である490µs以下を 満たすことが確認できた。よって、フルスケールモデルの ヒューズ溶断時間も設計値を満たす。試験の後、各素子 の外観にはいかなる変形も認められなかった。

参考文献

- W. Gagnon *et al.*, "Pulsed Power for Solid-State Lasers", Tech. Rep. LLNL-BOOK-400175, LLNL (2008).
- [2] Y. Morita *et al.*, "Capacitor bank of power supply for J-PARC MR main magnets", Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A, 901 (2018) pp.156-163
- [3] Y. Morita *et al.*, "Development of capacitor bank of J-PARC MR main magnet power supply for high repetition rate operation", Proceedings of the 14th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan, Sapporo, Japan, Aug. 1-3, 2017, pp. 1056-1060.
- [4] T. Shimogawa et al., "Status of new power supply for bending magnet in J-PARC Main Ring upgrade", Proceedings of the 15th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan, Nagaoka, Japan, Aug. 7-10, 2018.
- [5] T. Shimogawa *et al.*, "Development of charging control for floating capacitor method", Proceedings of the 15th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan, Nagaoka, Japan, Aug. 7-10, 2018.